

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
EVERS, CHRISTIAN DIPL-ING	DE
BEHRENDT, DETLEF DIPL-ING	DE
SIMON, JOCHEN DR ING	DE
ROHDE, ULRICH L PROF DR DR ING	US

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
ROHDE & SCHWARZ	DE
COMPACT SOFTWARE INC	US

APPL-NO: EP97102119

APPL-DATE: February 11, 1997

PRIORITY-DATA: DE19606986A ( February 24, 1996)

INT-CL (IPC): G01R027/28

EUR-CL (EPC): G01R027/28

*EP 0793110A2*

ABSTRACT:

<CHG DATE=19971202 STATUS=N> The method using a network analyser, takes account of the fault correction data, which would be determined during a previous calibrating process. The fault correction data, with the data of a simulation circuit, which is virtually interconnected with the object being measured, is logically linked and taken account of with the measurement of the object.

The fault correction data is stored in the form of a fault matrix in the network analyser. The simulation data is also determined in a matrix form.

The fault and simulation matrices are brought together in the same form, and logically linked to form a new fault/simulation matrix, which is then stored in the network analyser.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 793 110 A2**

(12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:

03.09.1997 Patentblatt 1997/36

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **G01R 27/28**

(21) Anmeldenummer: 97102119.1

(22) Anmeldetag: 11.02.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE GB SE

(30) Priorität: 24.02.1996 DE 19606986

(71) Anmelder:

- Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
D-81671 München (DE)
- Compact Software, Inc.  
Paterson, NJ 07504 (US)

(72) Erfinder:

- Evers, Christian, Dipl.-Ing.  
85551 Kirchheim (DE)
- Behrendt, Detlef, Dipl.-Ing.  
85567 Grafing (DE)
- Simon, Jochen, Dr.Ing.  
81547 München (DE)
- Rohde, Ulrich L., Prof.Dr.Dr.Ing.H.C.  
NJ 07458 (US)

(74) Vertreter: Graf, Walter, Dipl.-Ing.

Sckellstrasse 1  
81667 München (DE)

(54) **Verfahren zum Messen von elektronischen Messobjekten mittels eines Netzwerkanalysators**

(57) Zum Messen von elektronischen Meßobjekten mittels eines Netzwerkanalysators, die während ihres Betriebes und damit auch während des Messens in ein lineares Zusatznetzwerk einzubetten sind, wird wie folgt verfahren:

a) zunächst werden für den Netzwerkanalysator nach einem bekannten Kalibrierverfahren durch Anschalten von Kalibrierstandards Systemfehler-Korrekturdaten bestimmt;

b) dann werden für das zu benutzende Zusatznetzwerk dessen charakteristische Daten bestimmt und mit den Systemfehler-Korrekturdaten nach Merkmal a) zu neuen Fehlerkorrektur-/Simulations-Daten verknüpft;

c) schließlich werden diese Fehlerkorrektur-/Simulations-Daten bei der anschließenden Messung von an den Netzwerkanalysator angeschalteten Meßobjekten mit dem im Netzwerkanalysator vorhandenen Algorithmus zur Systemfehlerkorrektur entsprechend berücksichtigt, so daß ein virtuell mit dem Meßobjekt zusammengeschaltetes Zusatznetzwerk simuliert wird.

**EP 0 793 110 A2**

## Beschreibung

Bei der Fabrikation und Wareneingangsprüfung von elektronischen Netzwerken, beispielsweise elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Filter und dergleichen, ist es erforderlich, diese vor ihrem Einbau in Geräte genau zu messen. Für ein Messen der charakteristischen Daten solcher Netzwerke in einem vorgegebenen breiten Frequenzbereich eignen sich insbesondere Netzwerkanalysatoren. Der Netzwerkanalysator kann dabei beispielsweise als Reflektometer mit nur einem Meßtor ausgebildet sein, er weist im allgemeinen jedoch zwei Meßtore auf und ist als sogenannter vektorieller Netzwerkanalysator zum Messen der Ein- bzw. Zweitor-Parameter eines Meßobjekts nach Betrag und Phase aufgebaut (z.B. nach US 4 982 164).

Für eine genaue Messung ist es erforderlich, daß der Netzwerkanalysator durch Anschalten von Kalibrierstandards vorher kalibriert wird. Dabei werden beispielsweise drei Kalibrierstandards, von denen sämtliche Parameter bekannt sind, nacheinander an die Meßtore des Netzwerkanalysators angeschlossen und jeweils die Streu (S)-Parameter (Transmissions- und Reflexions-Parameter) gemessen und in Matrixform in einem Speicher des Netzwerkanalysators abgespeichert. Die so durch Kalibrieren ermittelten Systemfehler-Korrekturdaten in Matrixform können dann nach einem im Netzwerkanalysator vorhandenen Algorithmus bei der anschließenden Meßwertkorrektur berücksichtigt werden.

Die zu messenden elektronischen Netzwerke wie Bauelemente müssen während ihres Betriebes und damit auch während des Messens meist in ein lineares Zusatznetzwerk eingebettet werden, d.h. ein zu messendes Bauelement muß während des Betriebes beispielsweise eingangsseitig und/oder ausgangsseitig über ein Anpaßnetzwerk betrieben werden oder es muß parallel und /oder in Reihe zum Bauelement eine andere für den Betrieb erforderliche Zusatzschaltung vorgesehen sein. Ein typisches Beispiel ist ein Transistor, der in einem Hochfrequenzverstärker eingesetzt werden soll, der ein- und ausgangsseitig eine Impedanz von 50  $\Omega$  aufweisen soll. Da die Ein- und Ausgangsimpedanz des Transistors meist nicht 50  $\Omega$  beträgt, muß am Ein- und Ausgang eine entsprechende Anpaßschaltung vorgesehen werden. Für die Wareneingangsprüfung eines solchen Transistors beim Hersteller des Verstärkers ist es daher sinnvoll eine Meßfassung zu verwenden, in welcher diese speziellen Anpaßschaltungen eingebaut sind. Beim Messen eines in eine solche Meßfassung eingesetzten Transistors mittels eines kalibrierten Netzwerkanalysators erhält man somit die charakteristischen Daten (z.B. S-Parameter) für den gesamten Verstärker einschließlich Anpaßschaltung. Der Vorteil solcher Messungen ist, daß die gegebenen Spezifikationen für den Gesamtverstärker nicht in Toleranzgrenzen für den unbeschalteten Transistor umgerechnet werden müssen, sondern unmittelbar

verwendet werden können.

Dieses an sich vorteilhafte aufeinanderfolgende Messen von Bauelementen in großer Stückzahl besitzt jedoch den Nachteil, daß für mehrere gleichartige Meßplätze eines Prüffeldes möglichst gleiche Meßfassungen vorgesehen sein müssen und die jeweils integrierten Anpaßschaltungen enge Toleranzen einhalten müssen. Wenn außerdem das gleiche Bauelement für verschiedene Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Zusatzschaltungen betrieben werden soll, so müssen für jeden dieser Anwendungsfälle jeweils gesonderte Meßfassungen vorhanden sein. Je nach Meßobjekt und dessen Anwendungsbereich muß deshalb in einem Prüffeld eine Vielzahl von verschiedenen Meßfassungen vorhanden sein, die noch dazu unter sich mit engen Toleranzen gleich sein müssen. Dadurch werden solche Messungen sehr aufwendig und teuer.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Messen von elektronischen Meßobjekten mittels eines Netzwerkanalysators aufzuzeigen, bei dem auf einfache Weise solche zum Betrieb des Meßobjekts erforderliche Zusatzschaltungen berücksichtigt werden können.

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren laut Oberbegriff des Hauptanspruches durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen insbesondere auch bezüglich des einfachen Messens der charakteristischen Daten einer solchen Zusatzschaltung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Zur Ermittlung der optimalen Dimensionierung einer Anpaßschaltung, die einem Meßobjekt vorgeschaltet werden soll, ist es an sich bekannt, zunächst in einem ersten Verfahrensschritt die Streuparameter des Meßobjekts mittels eines Netzwerkanalysators zu messen und damit dann in einem zweiten Verfahrensschritt auf einem Rechner die Parameter der Anpaßschaltung zu berechnen, die eine optimale Anpassung ermöglichen (US-PS 5 321 364). Eine Ermittlung von Systemfehlerkorrekturdaten des Netzwerkanalysators und eine Verknüpfung dieser mit den Daten der Anpaßschaltung ist hierbei nicht vorgesehen.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird die beim Betrieb des Meßobjekts erforderliche Zusatzschaltung nicht konkret realisiert, sondern während der Messung nur simuliert. Die charakteristischen Daten der Zusatzschaltung, die entweder an einer konkret aufgebauten Muster-Zusatzschaltung durch Messen gewonnen oder durch ein bekanntes Simulationsprogramm berechnet werden, werden beim erfindungsgemäßen Verfahren unmittelbar mit den Systemfehlerkorrekturdaten des Netzwerkanalysators verknüpft. Beim anschließenden Messen des Meßobjekts, das nicht mehr in ein konkret aufgebautes Zusatznetzwerk eingebettet ist, sondern das unmittelbar mit den Meßtoren des Netzwerkanalysators verbunden wird, ergeben sich nach der Systemfehlerkorrektur die Meßdaten dennoch so, als ob das Zusatznetzwerk vorhanden wäre. Das Zusatznetzwerk wird also nur simuliert und die Messung erfolgt mit

einem virtuell mit dem Meßobjekt zusammengeschalteten Zusatznetzwerk. Damit sind bei dem oben erwähnten Anwendungsfall der Wareneingangsprüfung nur noch Universal-Meßfassungen erforderlich, in welche keine Zusatzschaltungen integriert sind. An einer beliebigen Vielzahl von Meßplätzen kann so jede beliebige Zusatzschaltung mit größter Genauigkeit beim Messen von beliebigen Meßobjekten berücksichtigt werden. Zum Wechseln einer Zusatzschaltung genügt es, einen anderen Simulations-Datensatz in den Netzwerkanalysator zu laden und mit den dort abgespeicherten Systemfehler-Korrekturdaten zu einer neuen Matrix zu verknüpfen.

Der überraschende Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vor allem darin zu sehen, daß für diese virtuelle Berücksichtigung eines Anpaßnetzwerkes der schon im Netzwerkanalysator implementierte Algorithmus zur Systemfehlerkorrektur benutzt wird, nach welchem ohne zusätzlichen Rechenaufwand pro Frequenzschritt des Netzwerkanalysators sofort eine entsprechende Korrektur der Meßwerte durchgeführt wird und zwar so schnell, daß damit praktisch Echtzeitmessungen durchgeführt werden können. Die zur Simulation des Zusatznetzwerkes erforderlichen Daten werden gleichzeitig mit den Systemfehlerkorrekturdaten bei der Messung berücksichtigt und die Meßzeit wird hierdurch also nicht verlängert.

Unter "charakteristische Daten" des Zusatznetzwerkes werden alle üblichen Matrixdarstellungen verstanden, also beispielsweise übliche Strom/Spannungs-Matrizen oder übliche Wellenmatrizen in Streuparameter (S)- oder Transmissions (T)-Parameterdarstellung. Das gleiche gilt für die Darstellung der Systemfehlerkorrekturdaten, auch hierfür sind all diese bekannten Matrixformen geeignet. Besonders vorteilhaft ist es, sowohl die Systemfehlerkorrekturdaten als auch die charakteristischen Daten des Zusatznetzwerkes in Transmissions (T)-Matrizenform darzustellen, da hiermit die neue Fehlerkorrektur/Simulations-Matrix auf einfache Weise unmittelbar durch Multiplikation der ursprünglichen Systemfehlerkorrektur (T)-Matrix mit der inversen T-Matrix des Zusatznetzwerkes bestimmt werden kann.

Die charakteristischen Daten der Zusatzschaltung können im einfachsten Fall nach einem an sich bekannten Simulationsprogramm berechnet werden, wie es beispielsweise in den Bedienhandbüchern des Programms SuperCompact der Firma Compact Software beschrieben ist. Mit einem solchen bekannten Simulationsprogramm kann das Verhalten einer beliebigen Hochfrequenzschaltung beispielsweise über einen in das Programm eingegebenen Stromlauf nachgebildet und als S-Matrix oder T-Matrix dargestellt werden. Eine solche durch Rechnung ermittelte Matrix kann dann unmittelbar mit der Systemfehlerkorrekturmatrix verknüpft werden.

In der Praxis läßt sich jedoch oftmals die optimale Dimensionierung einer solchen Zusatzschaltung nicht immer rein synthetisch durch Rechnung bestimmen,

insbesondere bei sehr hohen Frequenzen, da bei solchen Simulationsprogrammen parasitäre Größen der Zusatzschaltung nicht berücksichtigt werden. In solchen Fällen ist es vorteilhaft, eine für ein spezielles Meßobjekt erforderliche Zusatzschaltung als Muster-Zusatznetzwerk konkret aufzubauen und dann experimentell dieses Muster-Anpaßnetzwerk zu messen und auf diese Weise die charakteristischen Daten der Zusatzschaltung zu bestimmen, die dann wieder rechnerisch mit den Systemfehlerkorrekturdaten der Kalibrierung verknüpft werden. Ein solches unmittelbares Ausmessen der charakteristischen Daten eines Zusatznetzwerkes an einem entsprechenden Muster ist vor allem dann von Vorteil, wenn die Zusatzschaltung beispielsweise in eine vorhandene Meßfassung bereits integriert ist und dann nicht mehr als isolierte Schaltung gemessen werden kann. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, mittels einer Kalibrierung der inneren und äußeren Tore der Meßfassung und anschließender Quotientenbildung die T-Parameter der Meßfassung zu bestimmen. Durch eine weitere Quotientenbildung zwischen den T-Parametern der Meßfassung mit Zusatznetzwerk und der Meßfassung ohne Zusatznetzwerk kann diese Zusatzschaltung damit isoliert bestimmt werden und dann wieder für die Verknüpfung mit den Systemfehlerkorrekturdaten benutzt werden.

Für die Verknüpfung des beiden Matrizen ist es erforderlich, diese in die gleiche Form zu bringen. Wenn die Systemfehlerkorrekturdaten beispielsweise in Transmissionsmatrixform und die Daten der Zusatzschaltung beispielsweise in Kettenmatrixform vorliegen, wird die Kettenmatrix durch einen Konverter in die Transmissionsmatrixform umgewandelt und dann die beiden gleichartigen Matrizen zu einer neuen Transmissionsparametermatrix verknüpft, die dann wieder in den Speicher des Netzwerkanalysators eingespeichert wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch bei der Entwicklung von Hochfrequenzschaltungen von Vorteil, da hier beliebige Meßobjekte mit beliebigen simulierten Zusatzschaltungen betrieben werden können. Durch entsprechende simulierte Veränderung der Zusatzschaltung kann so die Entwicklung von Schaltungsmodulen oder Bauelementen sehr vereinfacht und erleichtert werden.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren ist es auch möglich, die Daten der Zusatzschaltung in aufeinanderfolgenden Messungen zu verändern, um so beispielsweise den Einfluß unterschiedlich dimensionierter Zusatzschaltungen auf das Meßobjekt zu ermitteln. Idealerweise ist die Software für die Bestimmung der Daten des Zusatznetzwerkes auf dem Netzwerkanalysator lauffähig und in einer gemeinsamen Bedienoberfläche des Netzwerkanalysators integriert, so daß der Benutzer des Netzwerkanalysators schnell und einfach das erfindungsgemäße Verfahren ausführen kann.

Die Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

Fig. 1 zeigt das Prinzipschaltbild eines Transistors

1, dem im Betrieb eingangsseitig eine lineare Anpaßschaltung 2 und ausgangsseitig eine Anpaßschaltung 7 zugeschaltet ist. Diese Anpaßschaltungen besitzen neben den berechenbaren Schaltungsteilen parasitäre Effekte, die rechnerisch nicht eindeutig erfaßbar sind. Die Anpaßschaltungen 2 und 7 können also in diesem Beispiel nicht exakt berechnet werden.

Fig. 2 zeigt einen bekannten Meßplatz zum Messen solcher Bauelemente, wie er bei der Wareneingangskontrolle benutzt wird. Der Meßplatz besteht aus einem vektoriellen Netzwerkanalysator 3 und einer Meßfassung 4, die über Koaxialkabel 5 und 6 mit den Meßtoren des Netzwerkanalysators verbunden ist und in die das zu messende Bauelement, beispielsweise der Transistor 1 nach Fig. 1 einsetzbar ist. In der Meßfassung 4 sind außerdem die Anpaßschaltungen 2 und 7 eingebaut.

Zur Kalibrierung des Netzwerkanalysators 3 werden zunächst anstelle der Meßobjekte Kalibrierstandards zwischen die Koaxialanschlüsse 8 und 9 geschaltet. Die so gewonnenen Systemfehler-Korrekturdaten werden in einem Speicher 10 des Netzwerkanalysators 3 abgespeichert, beispielsweise in Form von T-Matrizen G und H für die beiden Meßtore. Anschließend wird dann die Meßfassung 4 zwischen die Koaxialanschlüsse 8 und 9 geschaltet und der eingesetzte Transistor 1 zusammen mit den Anpaßschaltungen 2 und 7 gemessen. Auf diese Weise werden nacheinander eine Vielzahl von Transistoren gemessen. Wenn ein anderer Transistortyp gemessen werden soll oder ein Transistor während seines späteren Betriebes mit einer anderen Anpaßschaltung betrieben werden soll, muß eine andere Meßfassung 4 mit anderen Anpaßschaltungen 2 und 7 angeschlossen werden. An einem Meßplatz sind daher eine Vielzahl von unterschiedlichen Meßfassungen 4 erforderlich. Wenn in einem Prüffeld beispielsweise 10 solche Meßplätze vorhanden sind, muß diese Vielzahl von Meßfassungen auch 10 mal vorhanden sein, noch dazu in relativ engen Toleranzen gleich aufgebaut.

Diese teure Lagerhaltung von jeweils speziell dimensionierten Meßfassungen 4 wird nach dem erfindungsgemäßen Meßaufbau gemäß Fig. 3 vermieden. Hier ist nur noch eine Universal-Meßfassung 11 vorgesehen, die für alle Meßplätze gleich ist und die auch keine Anpaßschaltungen enthält. Die Meßfassung 11 ist unmittelbar mit dem Netzwerkanalysator 3 verbunden. Die charakteristischen Daten der Anpaßschaltungen werden beim Meßaufbau nach Fig. 3 entweder durch eine vorhergehende Messung oder durch Rechnung bestimmt und mit den Systemfehler-Korrekturdaten des Netzwerkanalysators 3 verknüpft und im Speicher 10 abgespeichert. Wenn die charakteristischen Daten der Anpaßschaltungen als Transmissions-Matrizen für die beiden Meßtore des Netzwerkanalysators mit N und M bezeichnet werden, so kann die Verknüpfung mit den Systemfehlerkorrektur-Matrizen G und H durch einfache Multiplikation der ursprünglichen Fehlerkorrekturmatrizen G und H mit den inversen N- und M-Matrizen

der Anpaßschaltungen gewonnen und im Speicher 10 des Netzwerkanalysators abgespeichert werden. Bei der Messung des Transistors 1 an einem Meßplatz gemäß Fig. 3 werden also pro Frequenzpunkt nacheinander an beispielsweise 400 Meßpunkten die jeweiligen rohen Meßwerte des Transistors 1 mit dem im Netzwerkanalysator vorhandenen Algorithmus Systemfehler korrigiert, wobei gleichzeitig die Anpaßschaltung virtuell berücksichtigt wird.

Wenn eine in Fig. 2 gezeigte Meßfassung 4 mit integrierten Anpaßschaltungen 2 und 7 bereits als Muster vorhanden ist, so können die charakteristischen Daten dieser Anpaßschaltungen 2 und 7 auf einfache Weise wie folgt bestimmt werden.

Zunächst wird durch Zwischenschalten von Kalibrierstandards zwischen die Koaxialleitungen 5 und 6 der Netzwerkanalysator bezogen auf die äußeren Anschlüsse 8 und 9 der Meßfassung 4 kalibriert. Dann wird gemäß Fig. 2 die Muster-Meßfassung 4 zwischen die Koaxialleitungen 5 und 6 geschaltet und in die später den Transistor aufnehmende Kontaktfassung der Meßfassung 4 werden entsprechende Kalibrierstandards eingelegt. Auf diese Weise werden die Fehlerkorrekturdaten für die inneren Anschlüsse der Meßfassung 4 bestimmt. Dann wird der Quotient zwischen diesen Fehlerkorrekturdaten der äußeren Anschlüsse 8, 9 und der inneren Anschlüsse der Meßfassung 4 gebildet. Anschließend wird gemäß Fig. 3 anstelle der Meßfassung 4 eine Universal-Meßfassung 11 an den Netzwerkanalysator angeschlossen und es wird der Unterschied zwischen den Daten der Meßfassung 4 mit Anpaßnetzwerken 2, 7 und der Meßfassung 11 ohne Anpaßnetzwerk bestimmt. Damit können die charakteristischen Daten der Anpaßnetzwerke 2 und 7 ermittelt werden, die dann mit den Systemfehler-Korrekturdaten des Netzwerkanalysators zu den neuen Fehlerkorrektur-/Simulations-Daten verknüpft werden.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Messen von elektronischen Meßobjekten mittels eines Netzwerkanalysators, die während ihres Betriebes und damit auch während des Messens in ein lineares Zusatznetzwerk einzubetten sind, dadurch gekennzeichnet, daß

a) für den Netzwerkanalysator nach einem bekannten Kalibrierverfahren durch Anschalten von Kalibrierstandards Systemfehler-Korrekturdaten bestimmt werden,

b) für das zu benutzende Zusatznetzwerk dessen charakteristische Daten bestimmt werden und mit den Systemfehler-Korrekturdaten nach Merkmal a) zu neuen Fehlerkorrektur-/Simulations-Daten verknüpft werden und

c) diese Fehlerkorrektur-/Simulations-Daten bei der anschließenden Messung von an den

Netzwerkanalysator angeschalteten Meßobjekten mit dem im Netzwerkanalysator vorhandenen Algorithmus zur Systemfehlerkorrektur entsprechend berücksichtigt werden, so daß ein virtuell mit dem Meßobjekt zusammengesetztes Zusatznetzwerk simuliert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Systemfehlerkorrekturdaten der Kalibrierstandards als auch die charakteristischen Daten des Zusatznetzwerks in Transmissions (T)-Matrizenform bestimmt und durch Multiplikation zu einer neuen Fehlerkorrektur/Simulations-Matrix verknüpft werden, die dann im Netzwerkanalysator abgespeichert und bei der anschließenden Messung eines Meßobjekts berücksichtigt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die charakteristischen Daten des Zusatznetzwerkes durch Messen an einem konkret aufgebauten Zusatznetzwerk bestimmt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die charakteristischen Daten des Zusatznetzwerkes mit einem an sich bekannten Netzwerksimulationsprogramm berechnet werden.
5. Verfahren nach Anspruch 3 zum Messen von elektronischen Bauelementen, die während der Messung in eine Meßfassung eingesetzt werden, in welche ein während des Betriebes der Bauelemente erforderliches Anpaßnetzwerk integriert ist, dadurch gekennzeichnet, daß
  - a) durch ein bekanntes Kalibrierverfahren die Fehlerkorrekturdaten für die inneren und äußeren Anschlüsse der Meßfassung bestimmt werden
  - b) damit die charakteristischen Daten der Meßfassung aus dem Unterschied dieser inneren und äußeren Fehlerkorrekturdaten ermittelt werden
  - c) und schließlich aus dem Unterschied der charakteristischen Daten der Meßfassungen mit und ohne Anpaßnetzwerk die charakteristischen Daten des Anpaßnetzwerks selbst ermittelt werden.

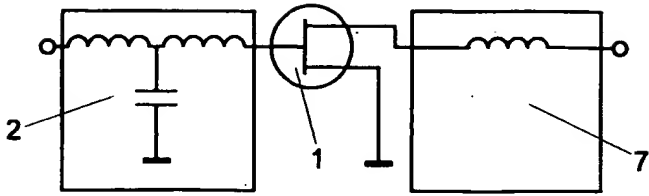


Fig.1

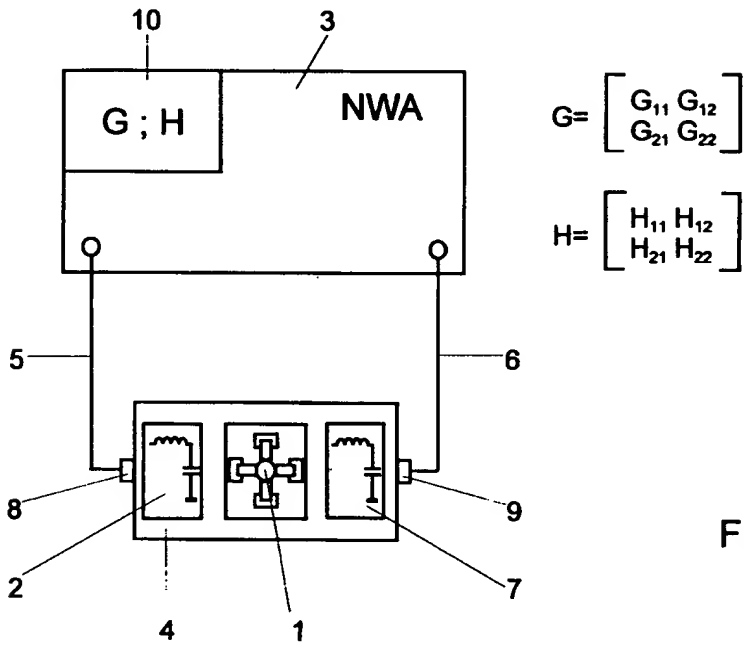


Fig.2

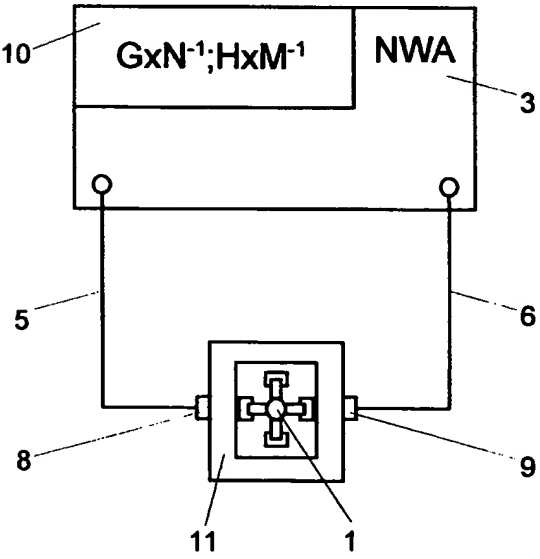


Fig.3